

Сведения об оппоненте

по диссертационной работе Кузнецовой Валентины Александровны на тему
«Разработка методики ускоренной оценки эксплуатационных характеристик танталовых конденсаторов с использованием теплового воздействия»
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка
информации (в науке и технике)(05.13.06 – Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами (в машиностроении и
приборостроении))

Фамилия Имя Отчество оппонента	Давыдов Георгий Георгиевич
Шифр и наименование специальностей, по которым защищена диссертация	05.13.05 – Электроника и автоматика электрофизических установок
Ученая степень и отрасль науки	Кандидат технических наук
Ученое звание	-
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Акционерное общество «Экспериментальное научно-производственное объединение «Специализированные электронные системы»
Занимаемая должность	Ведущий научный сотрудник
Почтовый индекс, адрес	115409, Москва, Каширское ш., д. 31
Телефон	+7(495) 788-56-99
Адрес электронной почты	ggdavydov@mephi.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<p>1. Davydov G.G., Skorobogatov P.K., Boychenko D.V., Dyatlov N.S. <u>Approach to estimation of modern ICS sustainability after series of single events</u> // В сборнике: 2017 17th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems, RADECS 2017.</p> <p>2. Skorobogatov P.K., Davydov G.G., Pechenkin A.A., Boychenko D.V. <u>Behavior of modern integrated circuits after latch-up parrying</u> // В сборнике: RAD Conference Proceedings. – 2017. – С. 159-162.</p> <p>3. Kessarinskiy L., Boychenko D., Nikiforov A., Davydov G., Krtskaya T., Polokhov A. <u>Power mosfet single event burnout hardness increasing by neutron preirradiation</u> // В сборнике: Proceedings of the International Conference on Microelectronics, ICM. 30. Cep. "2017 IEEE 30th International Conference on Microelectronics, MIEL 2017 - Proceedings". – 2017. – С. 165-166.</p> <p>4. Moskovskaya Y.M., Davydov G.G., Sogoyan A.V., Nikiforov A.Y., Yashanin I.B. <u>Total ionizing dose hardness nondestructive individual estimation and predictive grading for silicon-on-insulator ICS</u> // В сборнике: Proceedings of the International Conference on Microelectronics, ICM. 30. Cep. "2017 IEEE 30th International Conference on Microelectronics, MIEL 2017 - Proceedings". – 2017. – С. 267-270.</p>

5. Согоян А.В., Давыдов Г.Г., Артамонов А.С., Колосова А.С., Телец В.А., Никифоров А.Ю., Ожегин Ю.А., Каменева А.С., Московская Ю.М. Методика радиационной идентификации предприятия и характеристики технологии изготовления интегральных схем // Микроэлектроника. – 2017. – Т. 46. – № 4. С. 313-320.
6. Davydov G., Kolosova A., Sharipova A., Boychenko D. The automated system for parametric and functional control of the logic ICS // В сборнике: MATEC Web of Conferences. – 2016. – С. 01071.
7. Колосова А.С., Шарипова А.Р., Белова М.П., Давыдов Г.Г. Автоматизированный испытательный комплекс контроля параметров и функционирования логических микросхем // В сборнике: Компьютерные измерительные технологии. Материалы I Международного симпозиума. – 2015. – С. 246-249.

Верно

Директор
ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ

«06» 10 2020 г.

Телец В.А.

